3. 試作・少量用プリント回路基板の作成技術に関する研究

電子部 佐藤哲哉

要旨

エレクトロニクスの進展に伴い、プリント回路基板の製作期間短縮、試作の効率化等のために少量のプリント回路基板を簡易に作成する装置への関心が高まっている。しかし、近年の回路パターンは、益々微細化傾向にあり、従来の回路パターンを直接機械加工する方式では対応できなくなってきている。このため、微細加工が可能な高出力レーザによるプリント回路パターンの形成に関する研究を行った。この結果、銅箔厚が 18μ mであれば、本システムでの微細パターン加工が可能である。しかし、レーザのプリント基板の絶縁基材であるガラスエポキシに対する加工性の問題によりスルホール用の貫通穴の加工はできない。絶縁材の材質、レーザ光の波長の検討等が必要である。

1. 緒言

各種IC、LSI等を中心とする電子部品の進展に伴い、自動化、省力化機器の機能・性能は日々高度化し、かつ、軽薄、短小化してきている。これを支えている基本的要素の一つが、電子部品の配置、各部品間の配線を効率的に実現しているプリント基板である。

現在、プリント基板も多層化の傾向にあり4層プリント基板は、常識化しており6層等多層化の傾向が益々顕著になってきている。これら多層化基板は、表裏2面を除いてはプリントパターンの修正は困難である。このため、電子回路設計に基づく機能・性能確認のための試作段階においては、その使用に難があり、試作効率が低下する。

本来、専門メーカに依頼するプリント基板は、同じものを多量につくる場合等に適しており、試作段階のように、最低1枚あれば充分であり、かつ、状況によっては、配線の削除、追加等の変更が発生するような場合、あるいは、少量生産の場合には、経費、時間のロスが大きい。

また、現状のプリント配線の導体幅、導体間隔は、 $0.1\sim0.2\,\mathrm{mm}$ 、ランド径は、 $1\,\mathrm{mm}$ 以下とパターンの微細化が進んでいる。これら微細化されたパターンを自作する場合、従来のエッチング技術またはミーリングカッターによる機械的なパターン形成手法では、設備、ノウハウ、精度等の面で多くの問題がある。

このような状況を踏まえ、レーザを利用した試作・少 量用プリント基板の作成技術に関する研究を実施する。

2. 実験方法

実験構成図を図1. に示す。レーザからのビーム光は、

反射ミラーにより顕微鏡側面部に入射し、更に、顕微鏡内の干渉フィルターにてレーザ光のみが反射して対物レンズにより試料(プリント基板の原板)に集光・照射される。試料台は、XYZステージにより構成され、レーザ光のON/OFFを行うメカニカルシャッターと共に、パソコン(PC98NOTE)のGPIBにより制御される。また、加工による飛散物が対物レンズに付着するのを防ぐため、ノズルよりAirを試料に流す。加工状態はCCDカメラにより撮影し、モニターにて観察する。

なお、使用したレーザは、YAGレーザの第 2 高調波 (波長: 532nm)、繰り返し周波数: 50 H z、パルス幅: 6nsec、出力ネルギー: max90 m J (Spectra—Physics社G C R -150) である。

ここで、対物レンズは、超長作動距離対物レンズ (CFMPlan ELWD40×:ニコン製) で作動 距離が $10\,\mathrm{mm}$ 、焦点距離が $5.1\,\mathrm{mm}$ のものを使用している。

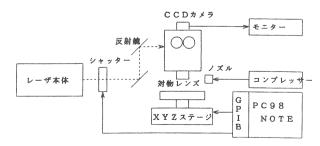


図1 実験構成図

このような一般の対物レンズを使用しているため、レーザのピークパワーが大きいとレンズ張り合わせ部等にて場合によってはレンズの割れ等が発生する恐れがある。本システムでは、ピークパワー:1 MW程度が使用限界である。

尚、本システムでは、対物レンズで集光されたレーザ 光の焦点位置と接眼レンズで見る焦点位置とは若干異なる。以後、集光されたレーザ光が試料表面に照射される 位置を照射位置と称し、接眼レンスで見るベストフォー カス位置(目視)を基準としてZ方向(+, 一)で表記 する。

レーザ光を対物レンズで集光する場合、レーザのピー クパワーによっては、その焦点位置空間において、プラ ズマの発生が見られる。プラズマの発生は、エネルギー の損失を伴うため、加工性の向上に寄与しないと言われ ている。

実験で使用する銅張積層基板は、信頼性に優れ、広く 産業用に普及しているガラス・エポキシ銅張積層基板 (銅箔の厚さ:18μm及び35μm)とする。

ここでは、利晶工業(株)製のCS-3230(銅箔の厚さ: $18 \mu m$ 及び $35 \mu m$)である。

3. 実験結果及び考察

3. 1. レーザによる銅張積層基板の銅箔面加工特性

3. 1. 1. 穴加工特性

穴加工特性は、銅張積層基板の銅箔面加工において、 線及び面 (パターン) を加工する際のレーザパワーの (平均値) 適性値、加工に要する時間、集光されたレー ザ光の照射位置の制約等の条件の基準となるものである。

(1) 穴加工に必要なレーザショット数

表 1 に 1 8 μ m 銅箔厚に対するレーザ光照射位置、レーザパワー、銅箔の貫通穴加工が可能なレーザパルス数の関係を示す。また、表 2 に 3 5 μ m 銅箔厚に対する同関係を示す。ここで、レーザ光照射位置は、CCDカメラ

	0.25 W	0.2 W	0.16 W	0.08 W	
6 5 μ m	2	3	3	×	
7 5	2	2	2	3	
8 5	2	2	2	2	
9 5	1	1	1	1	
1 0 5	1	1	1	1	
1 1 5	1	1	1	1	
1 2 5	2	2	2	2	
1 3 5	3	3	3	3	
1 4 5	×	×	×	×	

表 1 18 µ m銅箔貫通レーザShot数 (ここで、×は 4 Shot以上を要する。)

	0.25 W	0.2 W	0.16 W	0.08 W	
65 μ m	×	×	×	×	
75	×	×	×	×	
85	X	×	×	×	
95	3	3	3	3	
105	2	2	2	2	
115	2	2	2	2	
125	2	2	2	2	
135	4	4	4	4	
145	×	×	×	×	

表 2 35 μ m銅箔貫通レーザShot数 (ここで、×は 5 Shot以上を要する。)

によるモニタ上での観測されるベストフォーカス位置を 基準としてプラスZ方向の値である。

表 2 より、照射位置 $105 \mu m \pm 10 \mu m$ 内で $18 \mu m$ 銅箔厚の 18hot 加工が可能であることが解る。一方、表 35μ m 銅箔厚の 18hot 加工は困難であり、少なくとも 28hot 以上が必要である。この時の最適な照射位置は、 $115 \mu m \pm 10 \mu m$ であり表 2k 比べ、 $10 \mu m$ 程 2 プラス方向に移動している。これは、18hot 目で少なくとも $18 \mu m$ の深さ加工が可能(表 14 k)であるため、その分 28hot 目で等価的に照射位置が最適化したものであると考えられる。

(2)加工穴形状

写真1及び2にレーザパワー0.25W時の各々レーザ光の最適照射位置における左から1~3Shot照射時の表面形状SEM写真を示す。ピークパワーが大きいため、周辺部に盛り上がりが見られる。Shot数は、穴形状には顕著に関係せず深さ方向への影響に関係していることが解る。また、レーザパワーの相違による穴形状の顕著な差異は認められなかった。

写真1及び2に各々1Shot照射時の拡大SEM写真を示す。レーザ波長:532nmは、基本波:1064nmに比べて、熱的影響が少ないと考えられるが、加工部周辺部には、熱的影響部が観察される。18 μ m銅箔厚の場合、基材(ガラスエポキシ部)への影響も小さく比較的良い銅箔の貫通穴加工がなされていることが解る。一方、35 μ m銅箔厚の場合、貫通穴は形成されていず、更に大きなエネルギーが必要である。しかし、本レーザでは、パワーを増加するとフォーカス近傍でプラズマの発生が顕著となり、実際の加工特性の向上には寄与しな

い。このため、1 S h o t で貫通するためには、プラズマの発生を抑制するようレーザパルス幅が長く、ピークパワーが比較的大きなレーザシステムを使用する必要がある。

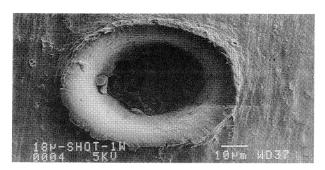


写真 1 18 µ m銅箔厚

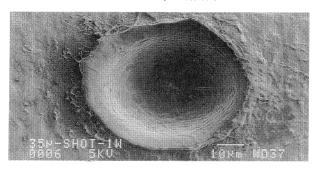


写真 2 35 μ m銅箔厚

(3)加工貫通穴径と表面穴径

ここで、貫通穴径は、銅箔部を貫通した穴径を、また、表面穴径は、盛り上がりを含めた表面部の穴径を表す。(図2参照)図3及び図4に各々1Shot、2Shot 照射時の銅箔貫通穴径と表面穴径を示す。0.16W以上で、レーザパワー、照射位置による加工貫通穴径、表面穴径の顕著な変化は見られないが、 18μ m銅箔の場合、照射位置 105μ mを中心として、 $+10\mu$ mでは加工貫通穴径、表面穴径共寸法的に 10μ m程度の減少が見られる。これは、 105μ mが正に銅箔表面でレーザ光のピントが合った状態であり、 115μ mでは表面上部にピントがあり、プラズマの発生によるエネルギーの損失に起因しているものと考えられる。一方、 95μ m

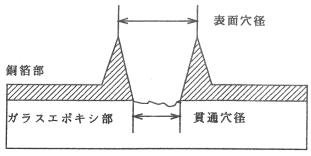


図2 加工貫通穴径と表面穴径

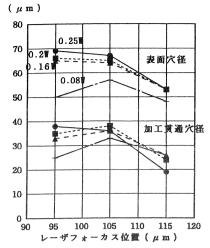


図3 加工貫通穴径と表面穴径

では、ピントが銅箔内部にあるため、プラズマの発生が 薄い銅箔をまきこんで加工性に若干の寄与をしているも のと考えられる。

また、 35μ m銅箔の場合、銅箔が厚いため1Shot目と2Shot目の照射時のレーザ光のピント位置がどこにあるかによって、加工特性が 18μ m銅箔の場合と若干異なっているものと考えられる。

これら関係から、 18μ m銅箔厚の場合、最小でも加工貫通穴径=約 20μ m、表面穴径=約 50μ mが確保される。また、 35μ m銅箔厚の場合、2Shot必要であるが同様に各々約 30μ m、約 40μ mが確保されると言える。

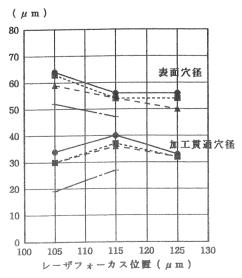


図4 加工貫通穴径と表面穴径(35 µ m)

しかし、この内の 35μ m銅箔厚の場合には、銅箔の 貫通穴加工に2Shot必要であり、本レーザシステム の使用を前提とするならば、レーザのShotの繰り返 し周波数が50Hzであるため、多大の加工時間を要し、 実用上問題がある。

以下、実用性を重視する意味で18μm銅箔厚に対する検討に限定する。

3. 1. 2 線加工特性

(1) 加工スピードによる加工特性

定速での線加工は、基本的には 3.1.1 項の穴あけ加工の延長である。使用するレーザ光は、50 H z のパルス光であるため、加工スピードによる制約を大きく受ける。 18μ m銅箔厚の場合、1 Shotで貫通する穴径は、照射位置= 105μ m± 10μ mの時、約 20μ m~ 40μ mである。このため、少なくとも、Shot間の距離は、 20μ m即ち、1mm/sec以下の加工スピードが必要となる。(1mm/sec÷50 H z = 20μ m)

また、一方、穴あけ加工時に観測されたもう一つの表面穴がこのようなShot穴あけ加工の連続として考えられる線加工にどのように影響を及ぼすかが課題となる。貫通穴は、直接加工に反映するが、表面穴は周辺部を含めてその内部構造への影響が考えられ、近接するShot加工時の相乗的影響を検討する必要がある。図 $5\sim$ 図7に、1mm/sec ~ 3 mm/secom加工スピードの時の線加工状態の模式図と写真を示す。(但し、レーザ照射位置= 105μ mである。)線加工としては、1mm/secomiの調査が相乗効果により、加工に寄与している。2mm/secomiの場合、連続的な線加工は困難である。

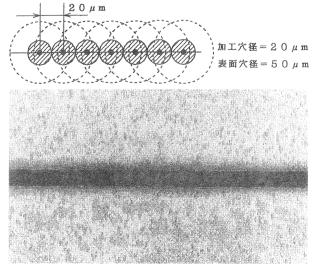


図5 線加工(1mm/sec)

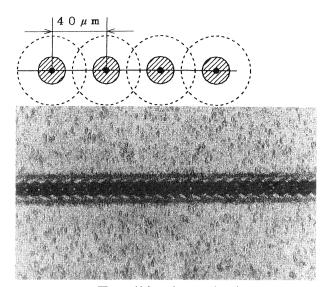
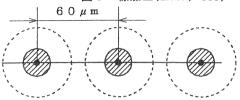


図 6 線加工(2mm/sec)



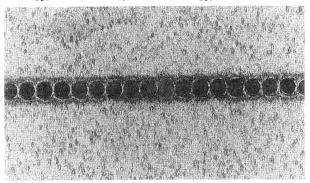


図7 線加工(3mm/sec)

(2) レーザパワー、照射位置による加工特性

表 3 に、加工スピード 1 mm/s e c の時のレーザパワー、フォーカス位置による線加工状態を示す。 3. 1. 1 項の表 2 と比較して、照射位置= 105μ mを基準と考えると、その(一)方向の照射位置= 85μ mでは、15hotでは銅箔の貫通はないが、線加工では隣接 5hotによる影響で連続加工が可能となっている。一方、同様(十)方向の照射位置= 125μ mでは、隣接 5hotによる加工性の向上が見られない。

この結果からも、集光されたレーザ光の焦点が銅箔の 内部にある時は、加工性(主に深さ方向)に寄与してい ることが解る。

以上により、レーザパワー= 0. 16 W以上ならば、 照射位置= 100μ m $\pm 15 \mu$ m で連続な線加工が可能 であることが解る。

		レーザパワー					
		0.25 W	0.2 W	0.16 W	0.08 W		
	75 μ m	Δ	×	×	×		
v	85	0	0	0	×		
ーザ照射位置	95	0	0	0	Δ		
	105	0	0		0		
	115	0	0	Δ	Δ		
	125	Δ	×	×	×		
	135	×	×	×	×		

表3 18 μ m銅箔の線加工 (〇:貫通加工、△:一部未穴、×:未穴)

(3) 加工断面形状

断面形状図を図8に示す。

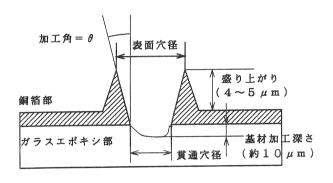
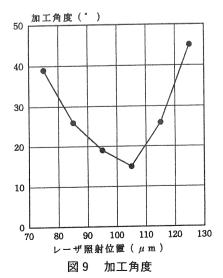


図8 断面形状図

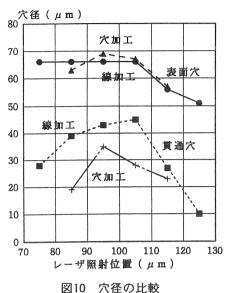
①加工角

レーザ光は、試料にある集光角をもって照射されるため、銅箔面を垂直状に加工することができず、テーパ状加工となる。レーザ光が一種の衝撃エネルギーであるため、その集光角(± 2 3.3度)との対応は困難であるが、レーザ照射位置= 105μ mを中心として、加工角が除々に大きくなっている。この関係を図9に示す。



②表面穴径と貫通穴径

3.1.1項で検討した表面穴径と貫通穴径に相当する径との比較関係を図10に示す。隣接Shotによる相乗効果は、貫通穴径の加工性(深さ方向の加工への寄与)に寄与している。



③その他

また、全体的に加工周辺部の $4\sim5~\mu$ m程度の盛り上がり、基材への加工深さ $1~0~\mu$ m程度が見られる。

3. 1. 3. 面加工特性

(1) 加工条件

レーザでの加工の場合、広い範囲の面を一度に加工することはできない。一次元加工である線加工を図11に示すように2次元に連続的に拡張していく他ない。線加工の場合、表面穴の相乗効果が一方向みであったが、面加工の場合は加工間隔によっては、多方向からの一層の相乗加工効果が期待される。一方、加工間隔を狭めることは、加工時間の増大を招く。

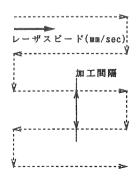


図11 レーザの軌跡

レー	レーザパワー 0.25 W		0.16 W			0.08W				
V(mm/sec)		1	2	3	1	2	3	1	2	3
加	3 0 μ m	0	0	Δ	0	0	Δ	0	Δ	×
エ	4 0 μ m	0	0	×	0	0	×	Δ	×	×
間	5 0 μ m	0	Δ	×	0	×	×	×	×	×
隔	6 0 μ m	Δ	×	×	0	×	×	×	×	×

表 4 加工間隔による面加工特性

(○:加工良、△:一部付着(除去可能)、×:未加工)

これら問題を検討するため、レーザパワー、加工速度、加工間隔をパラメータとして、照射位置= 105μ mのときの3mm×3mmの面加工を実施した。表4に加工特性、図12にその加工に要する時間の関係図を示す。

表4での〇印は、銅箔が完全に除去された状態であり、 △印は、銅箔と基材との剝離が完全ではなくその銅箔の 一部が基材に付着している状態である。しかし、これは 容易に除去可能である。

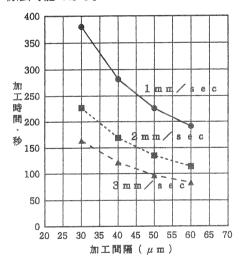
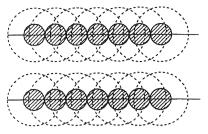


図12 加工間隔と加工時間(3mm×3mm)

レーザパワーが 0.16 W以上では、加工速度 $=1\sim2$ mm/s e c、加工間隔 $=30\sim40$ μ mの間で良好な加工が得られている。加工時間は、加工速度 =2 mm/s e c・加工間隔 =40 μ mの時、最短である。

面加工の場合、相乗効果を含めた直接的な加工のみならず、その加工間隔によっては銅箔と基材 (ガラスエポキシ部)との接着部を剝離することによって、間接的に加工に寄与すると考えられる。

このことにより、3. 1. 2項の線加工では、加工速度 $=2\,\mathrm{mm/s}$ e c の時は加工が困難であったが、面加工ではそれが可能となっている。図 $13\sim15$ に、表4でのレーザパワー=0. 25W時の加工間隔 $60\,\mu\mathrm{m}$ での加工状態を模式図と写真で示す。



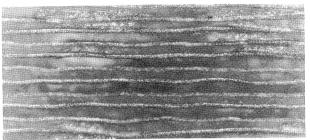
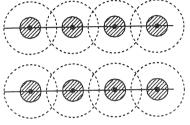


図13 面加工状態(加工速度=1mm/sec)



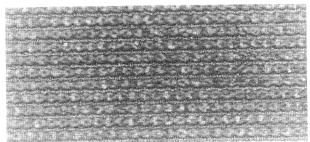
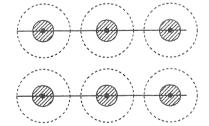


図14 面加工状態(加工速度=2mm/sec)



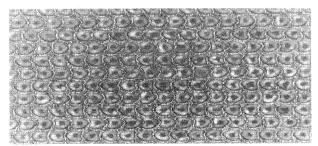


図15 面加工状態(加工速度=3mm/sec)

- (2) パターン加工
 - (1)項の条件を加味し、パターン加工を実施した。

加工条件は下記の通り。

<加工条件>

①レーザパワー : 0. 25W

②レーザ照射位置: 105 μm

③加工速度 : 2 m m / s e c

④加工間隔 : 4 0 μ m

加工された表面のSEM写真を写真3~4に示す。加工目標に沿う良好な加工がなされている。ただし、写真上、明確ではないが加工端では線加工と同様に4~5μm程度の盛り上がりがある。

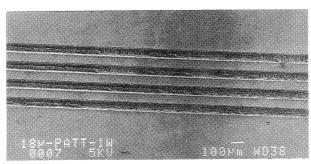


写真3 パターン加工例

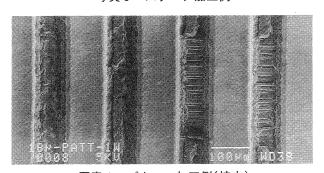


写真4 パターン加工例(拡大)

3. 1. 4. レーザによる基材の穴あけ加工

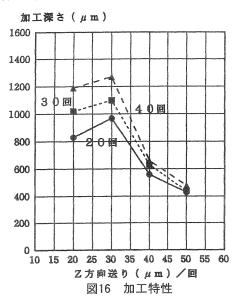
レーザによるガラスエポキシ基板への高精度な穴あけ 加工が可能であれば、従来のドリル加工で生じる粉塵の 解消、銅張積層基板を移動することなしに、同一設置面 でパターン加工と穴あけ加工が容易に実現できる。

このため、基板の加工性を検討した。サンプルは、 1.6mm厚のガラスエポキシ基板(CS3 230) <利晶(株)製>である。

図16に、 $1 \text{ mm} \times 1 \text{ mm}$ の穴加工時の各々の深さ方向の特性図を示す。ここで、レーザは、1 mm平方の周囲を $1 \text{ 回走査し、次に図中Z方向送りに相当する分Zステージを移動する。この繰り返し回数と加工深さとZ方向送りイテップとの関係を示している。この時、レーザザパワー=0.25W、レーザ走査加工速度=<math>1 \text{ mm}$

s e c、加工スタートレーザ照射位置= 105μ mである。図17にこれら加工に要する時間を示す。Z方向: 30μ mステップでの加工性が良い。しかし、1.6mm厚の穴加工は困難である。

写真5に、基材の穴加工断面図を示す。基材内部のガラス繊維による反射、散乱の影響で加工路が歪曲している。また、加工表面も鋭角的な加工性を有しておらず精度面からも問題がある。加工面仕上がり状況では、レーザが同一線上を幾度も走査されるため、基材に対する熱的影響が加工周辺部に観測され、ドリルによる加工面に比し著しく劣る。



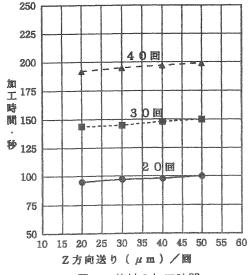


図17 基材の加工時間

これらより、基材に対する加工性には問題があると言える。高精度穴あけ加工には適さない。レーザ波長が更に短い、355nmまたは、266nm (YAGレーザ高調波)での検討が必要であろう。この際、紫外光であ

るため、本システムの可視光学系では役を成さない。紫 外光用光学系を構成する必要がある。

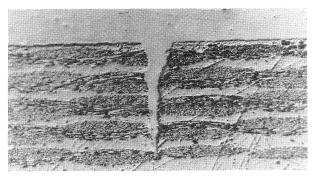


写真 5 ガラスエポキシ穴加工断面図 (30 μ m ステップ、30回)

3. 1. 5. 結論

(1) パターン形成

銅張積層基板の銅箔加工によるパターン形成について、 下記条件で現状での微細パターンとされている導体幅、 導体間: $0.1\sim0.2$ mmの加工が可能である。

①銅箔の厚さ : 18 μ m

②レーザパワー : 0. 16 W以上

③レーザ照射位置:100μm±15μm

④加工速度 : 1~2 mm/s e c

⑤加工間隔 : 30~40μm

(2)高精度穴加工

本システムのレーザ波長(532nm)での加工性には問題がある。パターン形成と同時に非接触で穴加工を実現することは困難である。このため、現状では、レーザによるパターン形成とドリルによる穴加工を併用することが妥当である。

3. 1. 6. 今後の課題

- (1) 広範囲なパターン加工をする際、銅張積層基板の 平行度を±15μm以内に保持する必要がある。
- (2)加工端部の盛り上がりが電気的特性に与える影響についての検討
- (3) 導体幅が狭い場合のレーザが銅箔と基材の密着性 に与える影響についての検討(銅箔の剝離強度)
- (4) レーザ波長による比較検討(1064nm、 355nm、266nm)ーパターン形成、基材の穴あ けー
- (5) レーザ波長による加工性の良い基材の材料検討
- (6) 加工時間の短縮化

(7) 本システムでは、レーザのON/OFFはメカニカルシャッターを使用している。このため、動作遅れによる加工過多が生じる。レーザのON/OFFは電子制御で行うことが望まれる。

参考文献

- ・平成6年レーザ学会第14回年次大会予稿集21aⅣ7及び21aⅣ8
- レーザ学会研究報告 RTM-93-33
- レーザハンドブック(朝倉書店)